

УДК 621.315.592

ПОПЕРЕЧНОЕ МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ ПЛЕНOK p-Ge  
В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Б.П. Зотьев

Основная цель работы - показать экспериментально возможность существования размерного эффекта на длине оствивания  $l_3$  [1,2] в приповерхностных обогащенных слоях полупроводников и влияние эффекта на интегральные характеристики пленок [3].

Исследовались монокристаллические пленки p-Ge, выращенные из жидкой фазы на сапфире [4]. Методика измерений описана в работе [5].

На рис. 1 приведены зависимости постоянной Холла  $R_x$  (кривая 1), поперечного магнитосопротивления (кривые 2,3 при напряженности магнитного поля  $H \approx 100$  кэ) и удельной электропроводности  $\sigma_0$  (кривая 4) от толщины  $d$  пленок (77°К).

В работе [4] показано, что структура исследуемых пленок может быть представлена в виде двух параллельно включенных слоев (однородный "объем" пленки и область обогащения у подложки  $d_s \approx 2$  мкм).

Если учесть физическое магнитосопротивление [6], различное в приповерхностном и "объемном" слоях, и магнитосопротивление, обусловленное градиентом концентрации и подвижности дырок [7], то зависимости магнитопроводимостей

$$\sigma_H = \sigma_0 / (1 + \Delta\rho/\rho_0)$$

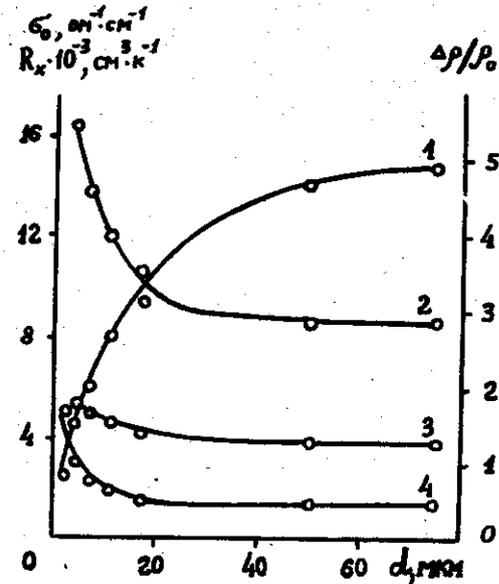


Рис. 1.

в сильном магнитном поле от толщины двухслойных образцов можно рассчитать, согласно работе [8]. Теоретические и экспериментальные зависимости  $\sigma_H$ , отнесенные к своим объемным значениям, от толщины при 77°К приведены на рис. 2. Как видно на рисунке, экспериментальные зависимости  $\sigma_H$  и, следовательно,  $\Delta\rho/\rho$  в магнитном поле, перпендикулярном плоскости пленки, полностью объясняются двухслойностью образцов (крив. 2 и точки для  $l_3 \approx 6$  мкм). В магнитном поле, параллельном плоскости пленки, экспериментальные точки (точки б - для  $l_3 \approx 6$  мкм) лежат существенно выше кривой 1, рассчитанной по [8]. Очевидно, это связано с появлением добавочной проводимости  $\Delta\sigma$  в среднем значении магнитопроводимости, когда  $H \perp \vec{n}$ . Здесь  $\vec{n}$  - нормаль пленки. Толщинная зависимость  $\Delta\sigma$ , отнесенная к объемному значению  $\sigma_H''$  (75 мкм), вынесена отдельно (рис. 2).

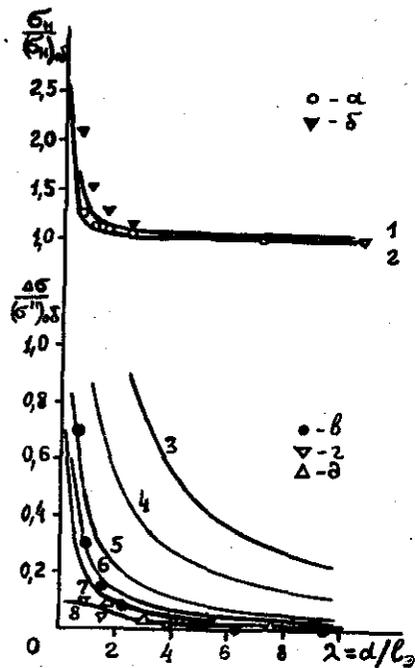


Рис. 2.

разцах (точки  $\gamma$  - для  $l_2 \approx 8 \mu\text{м}$ ,  $\delta$  - для  $l_2 \approx 4 \mu\text{м}$ ) и двухслойных пленках (точки  $\beta$  - для  $l_2 \approx 8 \mu\text{м}$ ). Наблюдается качественное соответствие теории и эксперимента. Однако в двухслойных образцах эффект больше, чем в однородных пленках (сравните кривые 3 и 8). Естественно отнести это увеличение за счет эффекта в приповерхностном слое, в котором, в основном, и реализуется анизотропное перераспределение дырок в магнитном поле [1,2,3].

Не исключено также существование в приповерхностном слое других эффектов, как, например, размерного эффекта на длине свободного пробега по импульсу. Однако разделить эти эффекты количественно в настоящее время не представляется возможным.

Результаты могут быть объяснены существованием на длине остывания размерного эффекта [1,2], который экспериментально показан на пленках  $p\text{-Ge}$  с обедненными поверхностями [9].

Толщинные зависимости  $\Delta\sigma / (\sigma_H'')_{об}$ , рассчитанные для двух механизмов рассеяния (кривые 3 - 7 - ионизированные примеси, 8 - акустические фононы), и различные константы  $\xi = 0; 1; 4; 7; 10$ , характеризующих взаимодействие дырок с поверхностью [1,2], приведены на рис. 2 (кривые 3 и 8, 4 - 7). Здесь же нанесены экспериментальные значения, полученные на однородных об-

## Л и т е р а т у р а

1. ГРИБНИКОВ З.С., МЕЛЬНИКОВ В.И. Размерный эффект в магнитосопротивлении полупроводников, - КЭТФ, 51, 1909, М., 1966.
2. БОЧКОВ В.С., ГУРЕВИЧ Ю.Г. Нелинейные размерные эффекты в магнитном поле, - ФТТ, II, 714, Л., 1969.
3. ГРИБНИКОВ З.С. Анизотропное перераспределение носителей вблизи заряженной поверхности полупроводника, - УФН, 16, 772, Киев, 1971.
4. КЛИМЕНКО Э.А., КЛИМЕНКО А.Г., КРАВЧЕНКО А.Ф., ЗОТЬЕВ Б.П., СКОК Э.М. Особенности электрофизических свойств слоев  $p\text{-Ge}$ , полученных на неориентирующих подложках, - "Известия вузов", Физика, Томск, в печати.
5. ЗОТЬЕВ Б.П., КОТ К.Н., ЮДАЕВ В.И. Измерение гальваномагнитных эффектов в полупроводниках в импульсных магнитных полях, - ПТЭ, 2, 154, М. 1971.
6. АНСЕЛЬМАН А.И. Введение в теорию полупроводников, Физматгиз, М., 1962.
7. H'LAZNIK J. Влияние градиентов концентрации и подвижности носителей тока на гальваномагнитные явления в полупроводниках, - SSE, 8, 5, 461, 1965.
8. КРАВЧЕНКО А.Ф., МОРОЗОВ Б.В., СКОК Э.М. Анизотропия магнитосопротивления и эффект Холла в тонких слоях полупроводников, - ФТТ, 6, Л., в печати.
9. ЗОТЬЕВ Б.П., КРАВЧЕНКО А.Ф., СКОК Э.М., ЮДАЕВ В.И. Размерная анизотропия поперечного магнитосопротивления полупроводниковых пленок в сильном магнитном поле, - ФТТ, Л., 1972.

Поступила в редакцию  
15.XI.1971 г.